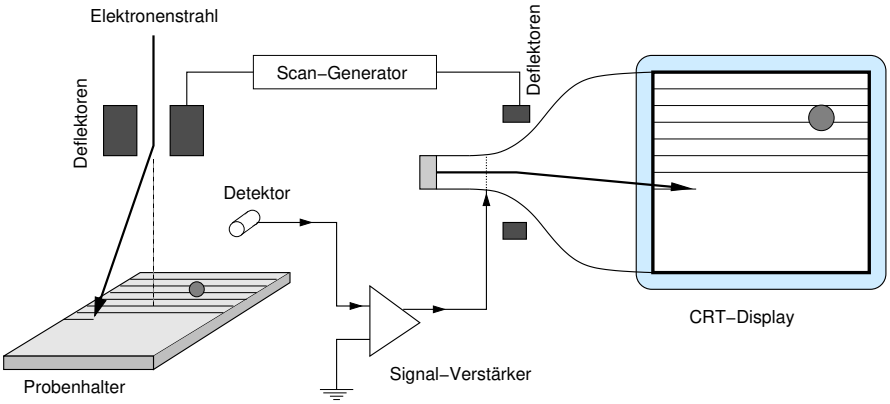
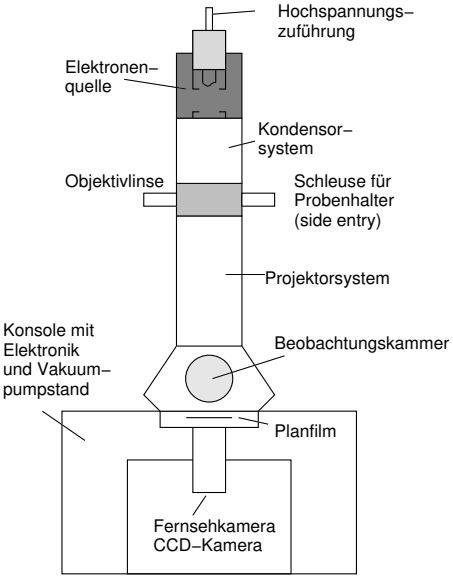
III. Bildgebende Verfahren 1: EM

Raster-Elektronenmikroskopie (REM=SEM)

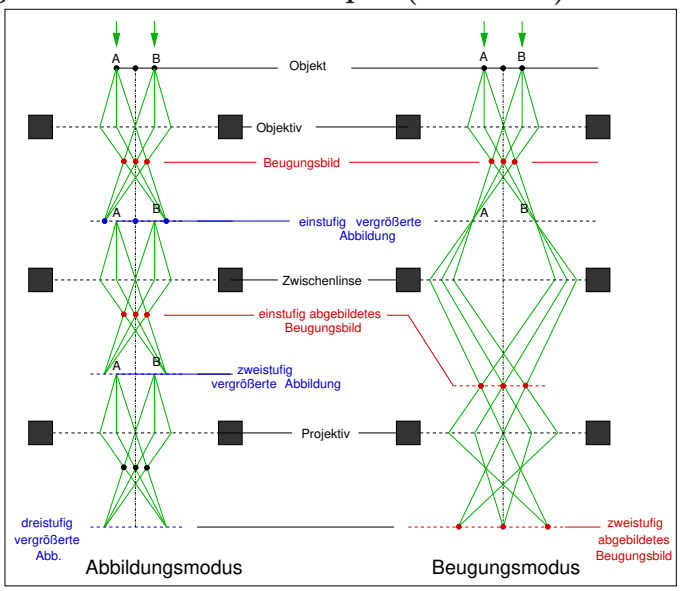


Funktionsprinzip des Rasterelektronenmikroskops

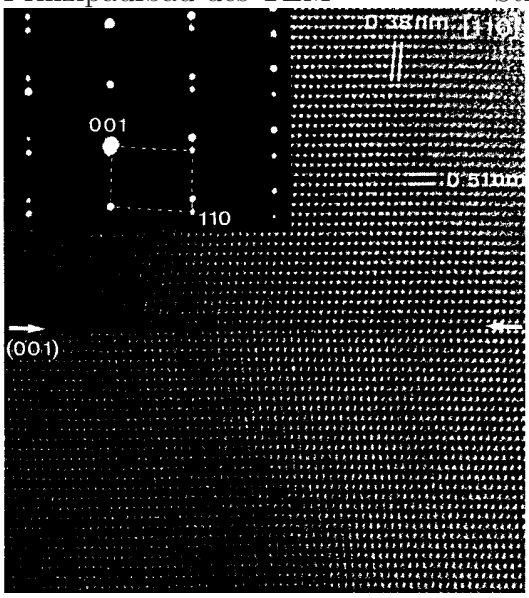
Hochaufgelöste Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie (HRTEM)



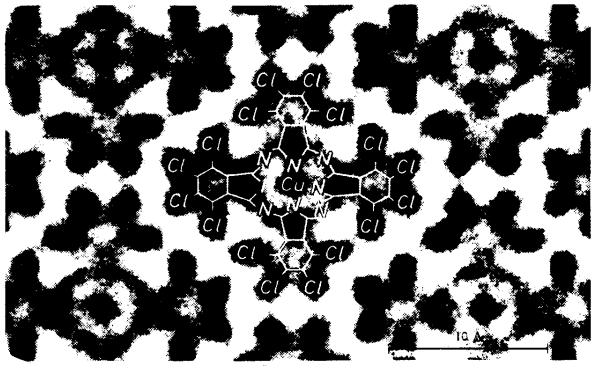
Prinzipaufbau des TEM



Strahlengänge im TEM



TEM-Aufnahme einer Zwillingsebene (entlang (001)) in $YTaO_4$ (links oben: Beugungsmuster)



Durchstrahlungsaufnahme von chloriertem Kupferphthalocyanin (500 kV, Aufnahme $\perp$ c-Achse)